

第44回 ナノテストティング シンポジウム



千里ライフサイエンスセンター
(大阪府豊中市千里中央)

2024年11月12日(火)～14日(木)

<https://inanot.sakura.ne.jp/nanots/>

secretariat@inanot.sakura.ne.jp

主催 ナノテストティング学会
会長 中前幸治(大阪大学)

協賛 (社)電子情報通信学会
(社)応用物理学会
日本信頼性学会
(財)日本科学技術連盟

目次

1. 会場	1
2. フロアマップ	2
3. 招待講演	2
4. オーサーズコーナー	3
5. イブニングセッション	3
6. 商業展示・コマーシャルセッション	3
7. ランチョンセミナー	3
8. 参加費	4
9. 参加申込要領	4
10. キャンセル規定	5
11. 宿泊施設のご案内	5
12. 会議録	5
13. 最新情報	5
14. ナノテストティング学会事務局	5
15. シンポジウム企画運営委員会	6
16. 講演プログラム	6
11月12日(火) 午前/ライフホール	6
11月12日(火) 午後/ライフホール	7
11月13日(水) 午前/ライフホール	8
11月13日(水) 午後/ライフホール	10
11月14日(木) 午前/ライフホール	11
11月14日(木) 午後/ライフホール	12
17. 著者索引	13
18. 商業展示	14
19. 賛助会員一覧	16

1 会場

講演会:

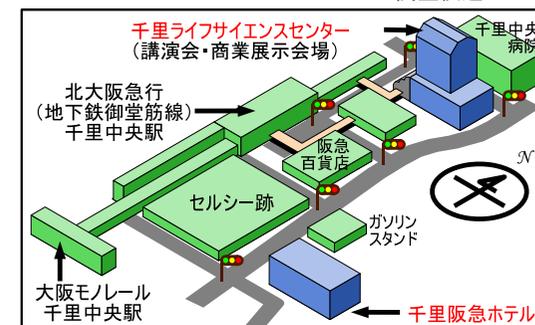
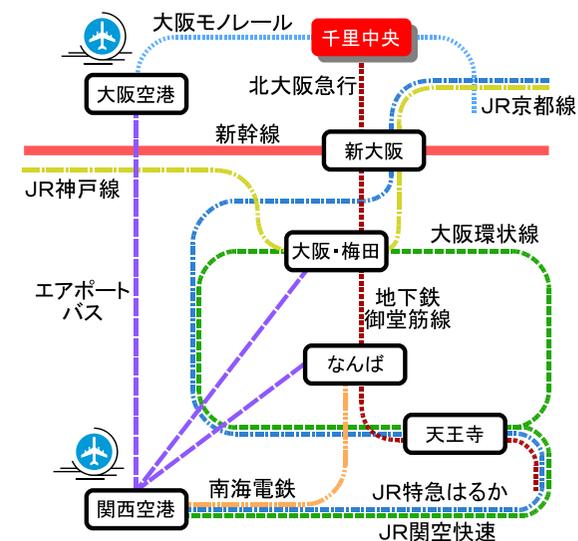
千里ライフサイエンスセンター 5F ライフホール
大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 Tel: 06-6873-2010
北大阪急行(大阪メトロ御堂筋線) 千里中央駅
北改札口 出口すぐ

商業展示:

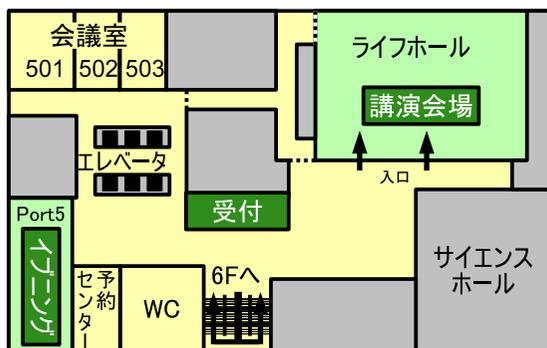
千里ライフサイエンスセンター 6F 千里ルーム
同上

イブニングセッション:

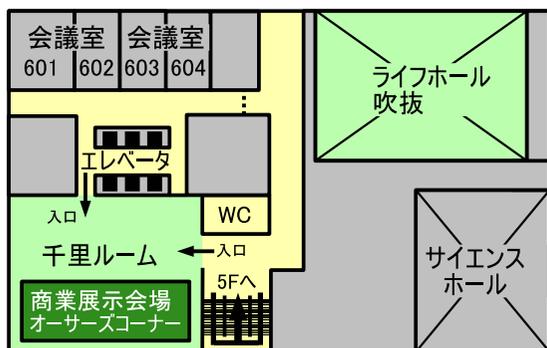
千里ライフサイエンスセンター 5F Port5
同上



2 フロアマップ



千里ライフサイエンスセンター 5F



千里ライフサイエンスセンター 6F

3 招待講演

下記の通り、招待講演を実施します。

11月12日(火) 9:30～10:30 : 一村信吾 先生 (早稲田大学/研究推進部 参与)

「ナノ材料管理のための複合計測システムの開発と計測分析機器の出力データフォーマット共通化」

11月12日(火) 13:15～14:15 : 苗村 万紀子 様 ((株)日立産機システム)

「製造業での生成 AI 導入事例 Talkative Products の事業背景と技術課題」

11月13日(水) 16:01～17:01 : 藤原 広和 様 ((株)ミライズテクノロジーズ)

「電動車用パワー半導体の進化と開発動向」

11月14日(水) 9:30～10:30 : 谷川 智之 先生 (大学院工学研究科)

「多光子励起フォトルミネッセンスによるワイドギャップ半導体の結晶欠陥評価技術」

11月14日(水) 13:15～14:15 : 藤嶋 辰也 様 ((株)Power Diamond Systems)

「究極のパワー半導体「ダイヤモンド半導体」の現状と展望～ディープテックスタートアップの創業の物語～」

4 オーサースコーナー

発表者の皆様とより活発な議論を行って頂ける場として、講演後にオーサースコーナー(6F千里ルーム)を設けます(コマーシャルセッションの講演は除く)。

5 イブニングセッション

イブニングセッションでは、P&A研究会の活動内容紹介に加えて、ナノテスティングに関する、世界での研究動向の報告と今後の展望について討論を行います。シンポジウム2日目11月13日(水)18:00～20:00、会場は千里ライフサイエンスセンター5F Port5です。

6 商業展示・コマーシャルセッション

シンポジウムでは、新たに開発した、改良した、ナノテスティングに関係する装置等を参加者にご紹介できる、また、ディスカッションできる商業展示フロア(6F千里ルーム)を準備しています。さらに、講演会場にて新製品をショートプレゼンテーションにて紹介できる、コマーシャルセッションを準備しています(2日目)。

7 ランチョンセミナー

11月13日(水)、昼食休憩時間帯に Luncheon Seminar が開催されます(無料)。事前申し込みが必要ですので、シンポジウム参加申し込みの際、参加するセミナーをチェックしてください。

日立ハイテク Luncheon Seminar : 11月13日(水)

テーマ : 日立の新しいナノプロービングシステムと AI 機能搭載の FIB-SEM 技術のご紹介

概要 : 半導体不良解析業務のお役にたてる、日立の顕微鏡技術の最前線をご紹介します。

8 参加費

参加費は、下記のいずれかの方法で10月25日(金)までにご送金下さい。

種別	金額	内容
一般	13,000円	全セッション+商業展示+会議録(ダウンロードのみ)
学生	5,000円	

《銀行振込》

口座 : りそな銀行 千里北支店 普通口座 6843152

加入者名 : ナノテスティングガツカイ ナカマエ コウジ

- ・送金後、振込情報を事務局へメールでご連絡下さい。

《クレジットカード》

シンポジウム Web で参加申し込みをして頂くと、事務局よりご登録いただいたメールアドレスにクレジットカードによる参加費支払いの方法をご案内させていただきます。

請求書、領収証の発行について

参加申し込みをして頂くと、下記の学会 Web の会員マイページにて印影の入った PDF 請求書を発行することができます。オンライン請求書での経理処理が困難な場合には事務局へお問合せ下さい。

<https://inanot.smoosy.atlas.jp/ja>

期日までにお支払い頂き、入金確認が完了した場合には、学会 Web の会員マイページより PDF 領収書を発行することができます。

9 参加申込要領

10月25日(金)(厳守)までに、下記のシンポジウム Web にてお申し込み下さい。非会員(前回参加から4年以上経過している場合も含む)の方は、学会 Web の「初回シンポジウム参加登録」より入会申請(会費は無料)も

併せてお願いします。すでに会員の方はログインして参加費のお支払い手続きをお願いします。

<https://inanot.sakura.ne.jp/nanots/>

本大会は事前参加登録のみとし、当日参加の受付を実施いたしません。必ず事前にお申し込みをお願いします。講演者、商業展示担当の皆様につきましても、全員参加申し込み手続きが必要です。

10 キャンセル規定

キャンセルの場合、下記の通り、キャンセル料を申し受けます。予めご了承ください。

- 10月25日(金)17:00まで：参加費の10%
- シンポジウム当日まで、あるいは、ご連絡無くご欠席の場合：参加費の100%

参加費をお支払い済みの場合、キャンセル料および銀行振り込み手数料を差し引いて、ご返金申し上げます。

11 宿泊施設のご案内

会場から徒歩約5分の位置に千里阪急ホテルがございます。宿泊ご希望の方は、下記、千里阪急ホテル Web サイトにてご予約下さい。満室になり次第、締め切りとなりますので、お早めにご予約下さい。

<http://www.senri-htl.co.jp/>

12 会議録

会議録は電子媒体(ダウンロード)のみでのご提供となります。ダウンロードのご案内は、2024年11月7日(木)に行います。講演プログラムは、印刷媒体で配布いたします。

13 最新情報

シンポジウムに関する最新情報は、下記 Web に随時掲載致します。適宜ご参照下さい。

<https://inanot.sakura.ne.jp/nanots/>

14 ナノテスティング学会事務局

ナノテスティング学会事務局 御堂義博・中前幸治

〒565-0871 吹田市山田丘1-5

大阪大学 大学院情報科学研究科

情報システム工学専攻 知的集積システム講座内

Tel/Fax: 06-6879-7813 / 06-6879-7812

E-mail: secretariat@inanot.sakura.ne.jp

Web: <https://inanot.sakura.ne.jp/nanots/>

15 シンポジウム企画運営委員会

委員長	中前 幸治	(大阪大学)
委員	朝比奈俊輔	(日本電子)
	小瀬 洋一	(日立ハイテク)
	姜 帥現	(キオクシア)
	小島 一信	(大阪大学)
	小山 徹	(富士電機)
	長 康雄	(東北大学)
	辻田 順彦	(ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング)
	寺田 浩敏	(浜松ホトニクス)
	二川 清	(デバイス評価技術研究所)
	樋口 裕久	(日立製作所)
	前田 一史	(ルネサスエレクトロニクス)
	山崎裕一郎	(TASMIT)

16 講演プログラム

11月12日(火) 午後 / ライフホール

- (1) 開会挨拶
09:20 中前幸治 / ナノテスティング学会会長

Invited Talk I 12日(火) a.m.

座長 中前幸治

- (11) ナノ材料管理のための複合計測システムの開発と
09:30 計測分析機器の出力データフォーマット共通化
一村信吾 / 早稲田大学産業技術総合研究所

…………… 10:30~10:50 オーサーズコーナー&休憩 ……………

Metrology and Inspection I 12日(火) a.m.

座長 小瀬洋一

- (2) デバイス評価用サンプル作製に向けたシリコン薄
10:50 化プロセスにおける表面粗さ制御
Y. I. Kawamura^(a), A. Uvarov^(b), A. Pageau^(b),
H. Shibata^(a), T. Lazerand^{(b) / (a)} Plasma-Therm-Japan
K.K., ^(b) Plasma-Therm Europe

- (3) プロセス評価を目的とした真円度と円形度を用いた
11:15 ホール形状の評価
中尾博樹, K. W. Jun, K. Christopher, 田中英夫 / サー
モフィッシャーサイエンティフィック

…………… 11:40~12:00 オーサーズコーナー&休憩 ……………

…………… 12:00~13:15 昼食休憩 ……………

11月12日(火) 午後 / ライフホール

Invited Talk II 12日(火) p.m.

座長 樋口裕久

- (12) 製造業での生成 AI 導入事例 Talkative Products
13:15 の事業背景と技術課題
苗村万紀子 / (株)日立産機システム

…………… 14:15~14:35 オーサーズコーナー&休憩 ……………

Metrology and Inspection II 12日(火) p.m.

座長 姜 帥現

- (4) 半導体断面構造の画像認識モデルを用いた自動
14:35 SEM 観察技術
土橋高志, 山本浩之, 大森健史 / 日立製作所研究開発
グループ

- (5) 半導体測長用電子顕微鏡画像の生成 AI モデルの
15:00 構築とそれに基づく試料情報推定
浅野修一朗, 御堂義博, 塩見 準, 三浦典之 / 大阪大学

…………… 15:25~15:45 オーサーズコーナー&休憩 ……………

Metrology and Inspection III 12日(火)p.m.

座長 朝比奈俊輔

- (6) CVNetを用いた頑健なパターン輪郭抽出法の
15:45 検討
村上慎治^(a), 大家政洋^(a), 岡本陽介^(b), 中澤伸一^(b),
丸山浩太郎^(b), 山崎裕一郎^(b), 御堂義博^(a), 三浦典之^(a)
/^(a)大阪大学, ^(b)東レエンジニアリング先端半導体 MI
テクノロジー
- (7) 高加速 SEM のシースルー BSE 画像における高
16:10 度な下層パターン輪郭抽出機能開発
大家政洋^(a), 岡本陽介^(b), 中澤伸一^(b), 丸山浩太郎^(b),
山崎裕一郎^(b), 村上慎治^(a), 御堂義博^(a), 三浦典之^(a)
/^(a)大阪大学, ^(b)東レエンジニアリング先端半導体 MI テ
クノロジー

..... 16:35~16:55 オーサースコーナー&休憩

11月13日(水)午前 / ライフホール

Metrology and Inspection IV 13日(水)a.m.

座長 山崎裕一郎

- (8) NEA 半導体フォトカソードを電子源とするパル
09:30 ス走査電子顕微鏡を用いた時間分解計測
森下英郎^(a), 大嶋 卓^(b), 桑原真人^(c), 揚村寿英^(b),
小瀬洋一^(b), 高根大地^(a), 齋藤 勉^(b) / ^(a)(株)日立製作所
研究開発グループ, ^(b)(株)日立ハイテク, ^(c)名古屋大学
未来材料・システム研究所
- (9) SiC ウェハ表面に導入された研磨ダメージの結晶
09:55 欠陥分布と ミラー電子像で形成されるコントラ
ストの関係
迫 秀樹^(a), 林 将平^(a), 大平健太郎^(b), 小林健二^(b),
一色俊之^(c) / ^(a)(株)東レリサーチセンター, ^(b)(株)日立
ハイテク, ^(c)京都工芸繊維大学

..... 10:20~10:40 オーサースコーナー&休憩

Commercial Session 13日(水)a.m.

座長 前田一史

- (C1) パルスレーザー高速試料加工装置紹介の利点
10:40 鈴木和弘, 市川 聡 / (株)ナノテクソリューションズ技
術部
- (C2) EOP を用いた故障解析における CAD-navi 活用
10:47 事例
井本 努, 平井一寛 / TOOL(株)
- (C3) エミッション顕微鏡用 Sequencer ソフトウェア
10:54 U15707-03
藤原将伸, 工藤宏平, 鈴木伸介, 山田拓也, 加納裕次郎
/ 浜松ホトニクス(株)システム事業部システム営業推
進部
- (C4) エミッション顕微鏡と周辺装置
11:01 越川一成, 沼尻祐哉, 中島義文 / 東機通商営業第一部
- (C5) Imina Technologies 社ナノプロービングソ
11:08 リューション
仲山洋輔 / (株)アポロウエーブ
- (C6) トランジスタの特性評価と故障特定における
11:15 Thermo Fisher Hyperion II AFM ベースのナノプ
ローブシステムの優位性
小屋義人 / サーモフィッシャーサイエンティフィック ;
セールスデベロップメント
- (C7) EBAC 像解析ソフト Image Data Manager のご
11:22 紹介
布施潤一^(a), 嶋守智子^(a), 呉 雨沢^(a), 小沢 賢^(b),
綿引 勝^(b), 備藤七生^(c), 土方基也^(c) / ^(a)(株)日立ハイテ
ク CT ソリューション開発部, ^(b)(株)日立ハイテク解析
ソフトウェア設計部, ^(c)(株)日立ハイテクグローバル営
業企画部
- (C8) Analysis system AZSA series
11:29 K. Konishi / Astron,Inc
- (C9) Visualization of p-n junctions of SiC devices
11:36 using "Spectrum Image" using the Auger
Electron Spectrometer (JAMP-9510F)
K. Ikita / JEOL Ltd.
- (C10) 最新の SEM/FIB デュアルビーム装置 Helios6HD
11:43 のご紹介
宗田俊彦 / 日本エフイー・アイ(株)

- (C11) カールツァイスにおける TEM ラメラ作製ワーク
11:50 フローの進歩
小幡卓真^(a), 小田武秀^(a), 前田悦男^(b) / ^(a)カールツァイ
ス日本, ^(b)カールツァイスシンガポール

- (C12) SiC/GaN 及びほとんどの半導体新材料の移動度・
11:57 シート抵抗非接触測定技術
熊懐正彦, S. Simayi, 加藤 巖 / 日本セミラボ(株)

- (C13) SiC/GaN 他 WideGap 半導体の電気的欠陥測定
12:04 サラムスマイ, 熊懐正彦, 加藤 巖 / 日本セミラボ(株)

- (C14) LSI プロセス診断のための Fin-FET 構造の評価
12:11 基準の構築
大谷直己, 柳生瑛子, 立山博丈, 村上 功, 谷田川裕生,
浅井憲二, 高森 圭 / 沖エンジニアリング(株)信頼性
ソリューション事業部

Luncheon seminar 13日(水)a.m.

- (L1) 日立の新しいナノプロービングシステムと AI 機
12:18 能搭載の FIB-SEM 技術のご紹介
備藤七生, 伊井由花 / 日立ハイテク

11月13日(水)午後 / ライフホール

Equipment and systems 13日(水)p.m.

座長 二川 清

- (10) X-ray nano-tomography enables high-resolution
13:41 investigations from micro-bumps to hybrid
bonding in advanced packaging
T. Dreier, D. Nilsson, S. Tanaka / Excillum AB
- (11) 新型ナノ X 線 CT 装置を用いた半導体アプリケー
14:06 ション
大垣智巳 / キヤノンマーケティングジャパン(株)

..... 14:31~14:51 オーサースコーナー&休憩

Fault Localization 13日(水)p.m.

座長 長 康雄

- (12) AI を活用した高精度位置推定技術
14:51 太田和男^(a), 杉山和弘^(b), 内田美幸^(b) / ^(a)東芝情報シス
テム(株), ^(b)(株)東芝
- (13) ロックイン技術を用いた EBAC 感度向上評価
15:16 (同期式-電子ビーム吸収電流法)
片倉康雄, 辻田順彦, 河村俊夫 / ソニーセミコンダク
タマニュファクチャリング(株)

..... 15:41~16:01 オーサーズコーナー&休憩

Invited Talk III 13日(水) p.m.

座長 中前幸治

(13) 電動車でパワー半導体の進化と開発動向
16:01 藤原広和 / (株)ミライズテクノロジーズ

..... 17:01~17:06 NANOTS2023 表彰

..... 17:06~17:11 集合写真撮影

..... 17:11~17:31 オーサーズコーナー&休憩

Evening Session 13日(水) p.m.

18:00 イブニングセッションでは、ナノテストングに関する、世界での研究動向の報告と今後の展望について議論します。会場は千里ライフサイエンスセンター 5F Port5 です。

座長 中前幸治

P&A 研究会の活動内容紹介, 他
小山 徹 / 富士電機

..... 20:00 閉会

11月14日(木) 午前 / ライフホール

Invited Talk IV 14日(木) a.m.

座長 寺田浩敏

(14) 多光子励起フォトルミネッセンスによるワイドギャップ半導体の結晶欠陥評価技術
09:30 谷川智之 / 大阪大学

..... 10:30~10:50 オーサーズコーナー&休憩

Photonics technology 14日(木) a.m.

座長 小島一信

(14) 全方位フォトルミネッセンス分光法による結晶品質の評価
10:50 鈴木健吾 / 浜松ホトニクス(株)

(15) 平面カソードルミネッセンスによるイオン注入ダメージの深さ分布推定
11:15 杉江隆一, 内田智之 / 東レリサーチセンター

..... 11:40~12:00 オーサーズコーナー&休憩

..... 12:00~13:15 昼食休憩

11月14日(木) 午後 / ライフホール

Invited Talk V 14日(木) p.m.

座長 小山 徹

(15) 究極のパワー半導体「ダイヤモンド半導体」の現状と展望 ~ ディープテックスタートアップの創業の物語 ~
13:15 藤島辰也 / (株)PowerDiamondSystems

..... 14:15~14:35 オーサーズコーナー&休憩

Power Device Analysis 14日(木) p.m.

座長 辻田順彦

(16) 低加速電圧 SEM と各種 CL 検出器による化合物半導体の分析
14:35 大塚岳志^(a), 中島雄平^(b), 朝比奈俊輔^(c), 名越達郎^(b) 岡野康之^(b) / ^(a)日本電子, 名古屋大学工学研究科, ^(b)日本電子, ^(c)日本電子, 東北大学多元物質科学研究所

(17) 走査型非線形誘電率顕微鏡法を用いた 3C-SiC/4H-SiC 積層構造 MOS 界面の定量評価
15:00 長 康雄^(a), 長澤弘幸^(b), 櫻庭政夫^(c), 佐藤茂雄^(c) / ^(a)東北大学未来科学技術共同研究センター, ^(b)(株)CUSIC, ^(c)東北大学電気通信研究所

..... 15:25~15:45 オーサーズコーナー&休憩

Physical Analysis 14日(木) p.m.

座長 二川 清

(18) 半導体解析における機械学習活用事例 ~ワイヤーボンド合金率測定自動化~
15:45 佐々木晶邦, 里 隼也, 辻田順彦, 石田宏之, 河村俊夫 / ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)

(19) 3次元ナノワイヤ GaN 結晶中の不純物ドーピング評価
16:10 曾根直樹^(a), 奥田廉士^(a), 野村明宏^(a), 上山 智^(b), 岩谷素顕^(b), 竹内哲也^(b) / ^(a)小糸製作所, ^(b)名城大学

..... 16:35~16:55 オーサーズコーナー&休憩

(20) 閉会挨拶
16:55 中前幸治 / ナノテストング学会会長

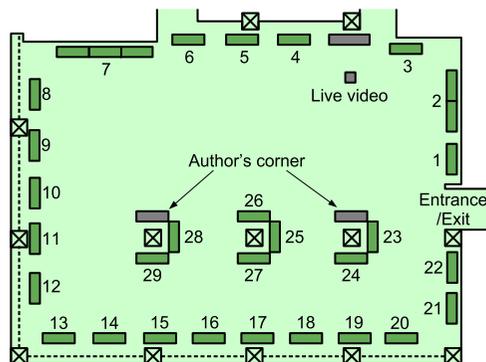
17 著者索引

※ 番号は講演プログラムにおける講演番号を示します。

英文	小田武秀 C11	土橋高志 4
T. Dreier 10	O. Tasgit C1	ナ行
K. Ikita C9		苗村万紀子 12
K. Christopher 3	カ行	中尾博樹 3
Y. I. Kawamura ... 2	片倉康雄 13	中澤伸一 6,7
K. W. Jun 3	加藤 巖 C12,C13	中島義文 C4
K. Konishi C8	加納裕次郎 C3	中島雄平 16
T. Lazerand 2	上山 智 19	中前幸治 1,20
D. Nilsson 10	河村俊夫 13,18	仲山洋輔 C5
A. Pageau 2	工藤宏平 C3	長澤弘幸 17
H. Shibata 2	熊懐正彦 .. C12,C13	名越達郎 16
S. Tanaka 10	桑原真人 8	沼尻祐哉 C4
A. Uvarov 2	越川一成 C4	野村明宏 19
ア行	小幡卓真 C11	ハ行
揚村寿英 8	小林健二 9	林 将平 9
浅井憲二 C14	小屋義人 C6	土方基也 C7
浅野修一朗 5	サ行	平井一寛 C2
朝比奈俊輔 16	齋藤 勉 8	備藤七生 C7
石田宏之 18	櫻庭政夫 17	藤島辰也 15
市川 聡 C1	迫 秀樹 9	藤原広和 13
一村信吾 11	石田宏之 18	藤原将伸 C3
一色俊之 9	佐々木晶邦 18	布施潤一 C7
井本 努 C2	佐藤茂雄 17	マ行
岩谷素顕 19	里 隼也 18	前田悦男 C11
内田智之 15	S. Simayi .. C12,C13	丸山浩太郎 6,7
内田美幸 12	塩見 準 5	三浦典之 5,6,7
呉 雨沢 C7	嶋守智子 C7	御堂義博 5,6,7
大垣智巳 11	杉江隆一 15	宗田俊彦 C10
大嶋 卓 8	杉山和弘 12	村上 功 C14
太田和男 12	杉山和弘 12	村上慎治 6,7
大谷直己 C14	鈴木和弘 C1	森下英郎 8
大塚岳志 16	鈴木健吾 14	タ行
大平健太郎 9	鈴木伸介 C3	高根大地 8
大森健史 4	曾根直樹 19	高森 圭 C14
大家政洋 6,7	チ行	竹内哲也 19
岡野康之 16	高根大地 8	立山博丈 C14
岡本陽介 6,7	高森 圭 C14	田中英夫 3
奥田廉士 19	竹内哲也 19	谷川智之 14
小沢 賢 C7	山崎裕一郎 6,7	長 康雄 17
小瀬洋一 8	山田拓也 C3	辻田順彦 13,18
	山本浩之 4	ワ行
	綿引 勝 C7	

18 商業展示

日時： 2024年11月12日(火)：13:00～17:00
2024年11月13日(水)：09:30～17:00
2024年11月14日(木)：09:30～16:00
場所： 千里ルーム (6F)



(展示フロアマップは、予告無く変更される場合があります)

- 丸文：
丸文故障解析ソリューション
- 日本エフイー・アイ:(C6, C10)
サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 日本バーンズ：
プロジェクションモアレ式・反り変形計測システム「TDM」
- アイテス：
パワー半導体の評価・解析ご紹介
- 阪和トレーディング：
シグナトーン社、半導体検査装置
- 日本マーテック：
受託分析サービス
- 浜松ホトニクス:(C3)
半導体故障解析装置、GaN 単結晶の品質定量評価装置
- 東機通商:(C4)
エミッション顕微鏡とその周辺装置
- Tool:(C2)
LAVIS-plus を利用した最新故障解析機能
- 東芝ナノアナリシス：
ナノレベル物理分析
- アポロウエーブ:(C5)
Imina Technologies 社ナノプロービングソリューション

- セイコーフューチャークリエーション：
FIB による IC 回路修正、FIB/TEM を用いた三次元断面観察による異物検出技術のご紹介
- 日本サイエンティフィック：
各種開封装置
- 日本セミラボ:(C12, C13)
For All Your Metrology Needs
- 日本電子:(C9)
電子顕微鏡を用いた故障解析
- Astron:(C8)
Analysis System AZSA-HS
- 三友製作所：
新製品 半導体デバイス局所研磨機 ELLMID のご紹介
- ハイテック・システムズ：
JIACO 社 MIP パッケージ開封装置 & Neocera Magma 社 MFI 故障解析用検査装置
- アド・サイエンス：
SEM/FIB 向けナノプロービングシステム、プラズマクリーナー、マニピュレータ、スパッタコーター
- アイ・アール・システム：
半導体不良解析のサーモグラフィの応用
- エキシルム：
ナノフォーカス X 線源 NanoTube / 高輝度マイクロフォーカス X 線源 MetalJet
- カールツァイス:(C11)
Carl Zeiss Co., Ltd.
- ナノテックソリューションズ:(C1)
パルスレーザーによる高速試料加工システム microPREP PRO-FEMTO
- クオルテック：
深層学習を用いたはんだボイド・クラック非破壊検査手法の開発
- 東陽テクニカ：
リアルタイム 4D-STEM TENSOR のご紹介
- 日立ハイテック:(C7)
最新製品ラインアップのご紹介
- エルテック：
製品ベンチマークサービス 解析レポート販売
- 沖エンジニアリング:(C14)
LSI プロセス診断での Fin-FET 構造における評価基準の構築
- コメットテクノロジーズ・ジャパン：
高分解能 X 線 CT システム

19 賛助会員一覧

(令和6年10月31日現在、50音順)

- (株) アイ・アール・システム
- (株) アイテス
- (株) アストロン
- (株) アド・サイエンス
- (株) アドバンテスト
- アプライド マテリアルズ ジャパン (株)
- (株) アポロウエーブ
- アメテック (株)
- エキシルム AB
- ATE サービス (株)
- (株) エルテック
- TASMIT(株)
- 沖エンジニアリング (株)
- カールツァイス (株)
- (株) クオルテック
- (株) コメットテクノロジーズ・ジャパン
- (株) 三友製作所
- セイコーフューチャークリエーション (株)
- TOOL(株)
- 東機通商 (株)
- 東芝ナノアナリシス (株)
- (株) 東陽テクニカ
- (株) ナノテックソリューションズ
- (株) ニコンソリューションズ
- 日鉄テクノロジー (株)
- 日本エフイー・アイ (株)
- 日本サイエンティフィック (株)
- 日本セミラボ (株)
- 日本電子 (株)
- 日本バーンズ (株)
- 日本マーテック (株)
- ハイソル (株)
- (株) ハイテック・システムズ
- 浜松ホトニクス (株)
- 阪和トレーディング (株)
- (株) 日立ハイテック
- プラズマ・サーモ・ジャパン (株)
- 丸文 (株)

(2024年11月1日版)